

SEMINÁRIOS DO CEMUP - 2008

SEMINÁRIOS E DEMONSTRAÇÃO EXPERIMENTAL

PARTICIPAÇÃO LIVRE

**Docentes, investigadores, técnicos superiores e estudantes finalistas
da Universidade do Porto**

Ficha de inscrição e Programa: www.cemup.up.pt

A - Microscopia de Varrimento de Sensor SPM: AFM / MFM / STM

Microscopia de força atómica – AFM, Microscopia de Força Magnética – MFM
e Microscopia de Efeito de Túnel – STM

Equipamento: Multimode / Nanoscope IV – Veeco Metrology

5 – 8 de Maio de 2008 das 16:00 - 17:30 H

B - Microscopia de Electrónica de Varrimento e Microanálise por Raios X – SEM/EDS Microscopia Electrónica de Varrimento a baixa temperatura - CryoSEM

**Equipamentos: SEM /EDS - JEOL JSM 6301F / INCA Energy 350
CryoSEM: GATAN Alto 2500**

13 – 16 de Maio de 2008 das 16:00 - 17:30 H

C - Microscopia de Electrónica de Varrimento e Microanálise por Raios X – SEM /EDS Microscopia Electrónica de Varrimento em Baixo Vácuo e Ambiental LVSEM / ESEM Análise de Padrões de Difracção de Electrões Retrodifundidos - EBSD

Equipamento: FEG_ESEM /EDS /EBSD - FEI QUANTA 400 FEG / EDAX GENESIS 4XM

26 – 30 de Maio de 2008 das 16:00 - 17:30 H